

液晶パネルの異物・汚れ成分の同定・推定

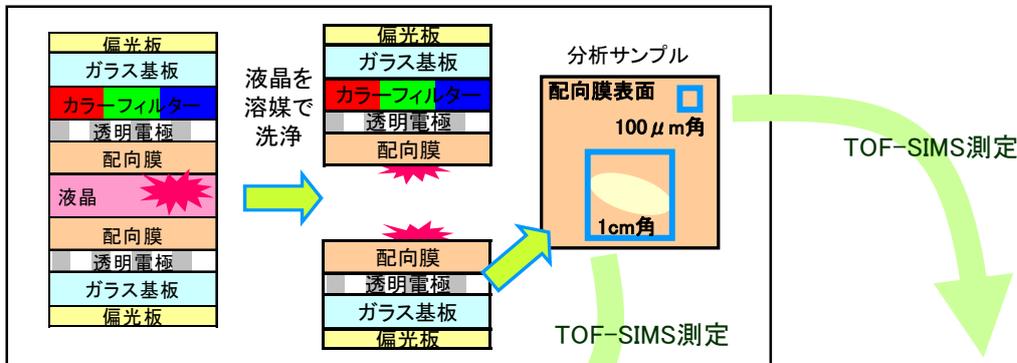
ミクロンからセンチオーダーの異物・汚れをイメージとして捉えます

測定法 : TOF-SIMS
 製品分野 : ディスプレイ
 分析目的 : 組成評価・同定・組成分布評価

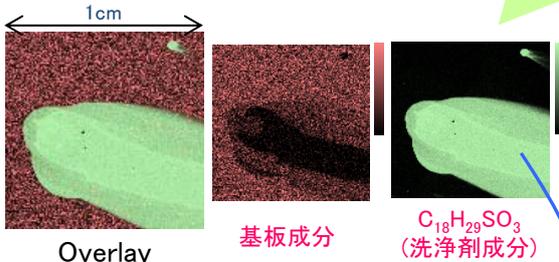
概要

液晶パネルの量産化において、欠陥(異物・汚れ)を除去することが求められています。そこで、原因となる異物・汚れが何に起因するか調査することは、歩留まり向上に有効です。
 液晶パネルの異物・汚れを評価した事例を紹介します。TOF-SIMSでは μm ~ cm オーダーの洗浄残渣をイメージとして捉えることが可能です。また、標準スペクトルとの比較により、成分の推定が可能です。

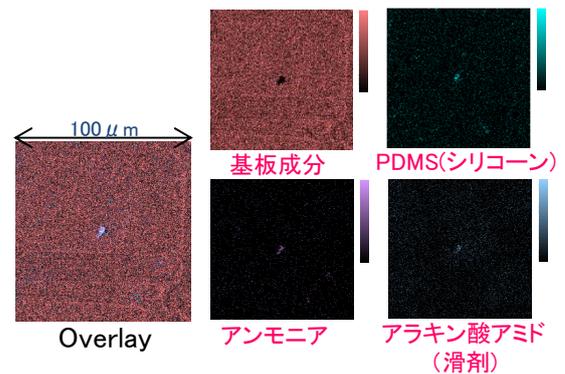
データ



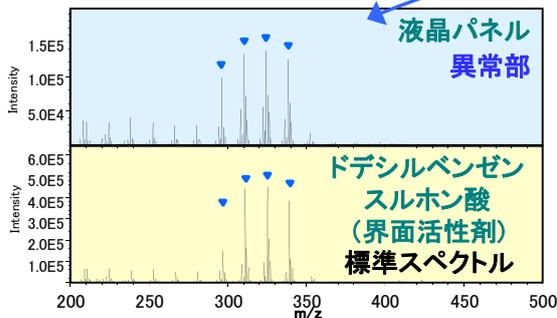
■ cm オーダーの付着物のイメージ可能



■ μm オーダーの異物のイメージ可能



■ 残渣の同定が可能



分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！